

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРІВ

SENSOR MATERIALS

УДК 621. 315. 592

PACS 72.20. PA

КОЕФІЦІЕНТ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ ДОБРОТНОСТІ КРИСТАЛІВ

$Hg_{1-x}Mn_xS$ і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$

П. Д. Мар'янчук, Г. О. Андрушак

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

вул. М. Коцюбинського 2, 58012, Чернівці, Україна

e-mail: p.maryanchuk@chnu.edu.ua

КОЕФІЦІЕНТ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ ДОБРОТНОСТІ КРИСТАЛІВ $Hg_{1-x}Mn_xS$ і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$

П. Д. Мар'янчук, Г. О. Андрушак

Анотація. В даній роботі на основі досліджень електропровідності і термо-е.р.с. проведена оцінка величини коефіцієнта термоелектричної добrotности (Z) кристалів $Hg_{1-x}Mn_xS$ і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$. На основі одержаних значень Z можна робити висновки про можливості використання цих матеріалів у термоелектричних пристроях.

Ключові слова: напівпровідник, термоелектрична добrotность, електропровідність

COEFFICIENT OF CRYSTALS' $Hg_{1-x}Mn_xS$ and $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ THERMOELECTRICAL QUALITY

P. D. Maryanchuk, G. O. Andrushchak

Abstract. In this work we have valued the coefficient of crystals' $Hg_{1-x}Mn_xS$ and $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ thermoelectrical quality on the basis of electric conductivity and thermo e.m.p. research. On the basis of the received values Z we can draw the conclusion as for the possibility of usage of these materials in thermoelectrical devices.

Keywords: semiconductor, thermoelectrically quality, conduction

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДОБРОТНОСТИ КРИСТАЛЛОВ

$Hg_{1-x}Mn_xS$ и $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$

П. Д. Марьянчук, Г. О. Андрушак

Аннотация. В данной работе на основе исследований электропроводности и термо-э.р.с. проведена оценка величины коэффициента термоэлектрической добrotности (Z) кристаллов $Hg_{1-x}Mn_xS$ и $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$. На основе полученных значений Z можно сделать заключения о возможности использования указанных материалов в термоэлектрических устройствах.

Ключевые слова: полупроводник, термоэлектрическая добrotность, электропроводимость

В даний час іде інтенсивний пошук нових термоелектричних матеріалів, які б володіли високим коефіцієнтом термоелектричної добробутності, з метою їх застосування при виготовленні термоелектричних пристрій. Більшість відомих термоелектричних матеріалів на основі халькогенідів ртуті характеризуються порівняно низьким коефіцієнтом термоелектричної добробутності [1].

Метою даної роботи було покращення термоелектричних властивостей твердих розчинів на основі халькогенідів ртуті шляхом зміни атомарного складу кристалічної гратки твердо-го розчину та впливу термообробки на термоелектричні властивості кристалів.

Напівмагнітні напівпровідникові тверді розчини $Hg_{1-x}Mn_xS$, область існування яких ($0 < x \leq 0,375$) [2], і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ отримані нами методом Бріджмена, володіють провідністю n-типу (концентрація електронів $n \sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$).

Дослідження кінетичних властивостей кристалів показало, що термо-е.р.с. $|\alpha|$ кристалів $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ (рис. 1) (як і кристалів $Hg_{1-x}Mn_xS$ [3,4]) зростає з підвищенням температури, оскільки при збільшенні T зменшується ступінь виродження електронного газу в зразках. Електропровідність (σ) зразків $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ (рис. 2) (так само як і $Hg_{1-x}Mn_xS$ [3,4]) до і після термообробки в парах S і Hg має металічний характер, тобто зростає із зниженням температури. Після термообробки в парах ртуті і сірки електропровідність зразків $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ зменшується (особливо при низьких температурах) (рис. 2). Крім цього відпал у парах ртуті при-водить до зменшення концентрації електронів і збільшення їх рухливості, а в парах сірки до збільшення концентрації електронів і змен-шення їх рухливості.

Провівши вимірю термо-е.р.с. (α), питомої електропровідності (σ) і знаючи теплопровід-ність (λ), можна визначити коефіцієнт термо-електричної добробутності $Z = \frac{\alpha^2 \cdot \sigma}{\lambda}$ кристалів

$Hg_{1-x}Mn_xS$ і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$, а також оцінити можливість їх використання як матеріалу для термоелектричних пристрій.

Відсутність у літературі даних про величину теплопровідності (λ) твердих розчинів $Hg_{1-x}Mn_xS$, $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ і HgS обумовило ви-користання при оцінці параметрів Z величини λ такої ж як і для $HgSe$. Справа в тому, що для халькогенідів ртуті із структурою сфалериту

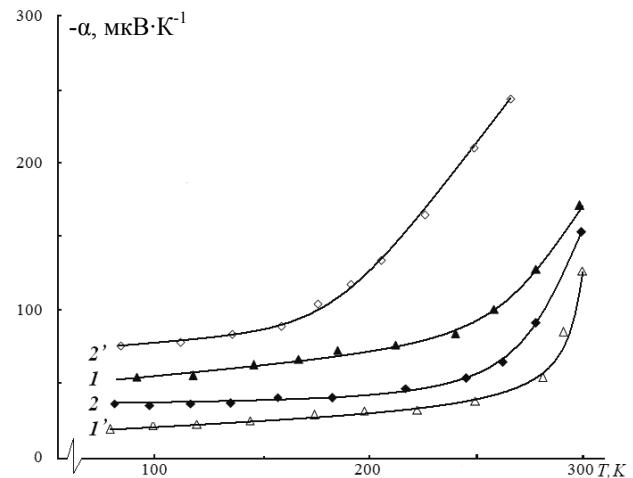


Рис. 1. Температурна залежність термо-е.р.с. зразків $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$: 1,1' — $(x+y)_{\text{м}}=0,06$; 2,2' — $(x+y)_{\text{м}}=0,1$; 1 — до відпалу в парах S; 1' — після від-палу в парах S; 2 — до відпалу в парах Hg; 2' — після відпалу в парах Hg.

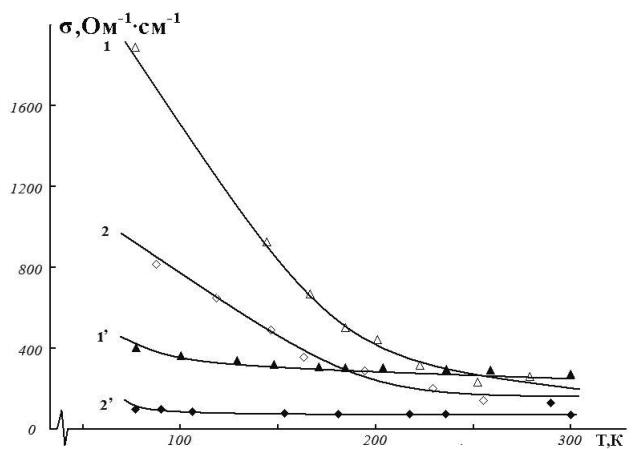


Рис. 2. Температурна залежність електропровіднос-ті зразків $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$: 1,1' — $(x+y)_{\text{м}}=0,06$; 2,2' — $(x+y)_{\text{м}}=0,1$; 1 — до відпалу в парах S; 1' — після від-палу в парах S; 2 — до відпалу в парах Hg; 2' — після відпалу в парах Hg.

значення граткової теплопровідності $\lambda_r \approx 0,02 \text{ Вт}/\text{см}\cdot\text{град}$ [5] для $HgTe$, а для $HgSe$ $\lambda_r \approx 0,019 \text{ Вт}/\text{см}\cdot\text{град}$ [5]. Оскільки ці значення λ_r для $HgTe$ і $HgSe$ мало відрізняються, то можна припустити, що і для HgS (з структурою сфалериту) λ_r буде приблизно такою ж (або ще меншою). Враховуючи також те, що все-таки HgS близ-чий за властивостями до $HgSe$, тому прийма-ємо $\lambda(Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS) \approx \lambda(Hg_{1-x}Mn_xS) = \lambda_r(HgS) \approx \lambda_r(HgSe) = 0,019 \text{ Вт}/\text{см}\cdot\text{град}$, де $\lambda_r(HgSe)$ — граткова теплопровідність $HgSe$ (при $T \approx 300 \text{ K}$). Врахування електронної теплопровідності (λ_e) збільшо би $\lambda(Hg_{1-x}Mn_xS) \approx \lambda_r(HgS) + \lambda_e$, а вра-хування характерної особливості граткової те-

плопровідності твердих розчинів, яка полягає в значному зменшенні її величини в порівнянні з вихідними компонентами [5], привело би до зменшення λ на $\Delta\lambda_r$ і тоді $\lambda(Hg_{1-x}Mn_xS) \approx \lambda_r(HgS) - \Delta\lambda_r + \lambda_e$. З огляду на те, що $\Delta\lambda_r$ і λ_e величини одного порядку, але протилежні за знаком, приймаємо для $Hg_{1-x}Mn_xS$ і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$, що $\lambda(Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS) \approx \lambda(Hg_{1-x}Mn_xS) \approx \lambda_r(HgS) \approx \lambda_r(HgSe) = 0,019 \text{ Вт}/\text{см}\cdot\text{град}$ (для малих складів "x" близьких до HgS).

Отримані в такий спосіб значення Z (при $T \approx 300 \text{ К}$) представлені в таблиці 1 для зразків $Hg_{1-x}Mn_xS$ і в таблиці 2 для зразків $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$. З таблиць 1 і 2 видно, що відпал приводить до збільшення коефіцієнта термоелектричної добротності, а введення атомів Fe у твердий розчин також приводить до різкого збільшення Z (табл. 1 і 2, $x_m = 0,12$ і $(x+y)_m = 0,1$).

Таблиця 1
Коефіцієнт термоелектричної добротності кристалів $Hg_{1-x}Mn_xS$

x_m	$n \cdot 10^{-18}, \text{ см}^{-3}$	$\sigma, \text{ Ом}^{-1} \text{ см}^{-1}$	$\alpha, \text{ мкВ}/\text{град}$	$Z \cdot 10^3, \text{ град}^{-1}$	Відпал
0,017	1,1	184	200	0,37	до відпалу
0,027	0,9	76	155	0,09	до відпалу
0,03	2,7	49	79	0,15	до відпалу
	2,7	594	78	0,18	відпал в парах ртуті
0,03	12	488	95	0,22	до відпалу
	2,4	593	154	0,7	відпал в парах сірки
0,046	0,9	69	120	0,05	до відпалу
0,069	0,5	25	210	0,06	до відпалу
0,12	5,9	78	180	0,13	до відпалу

Склади зразків x_m і $(x+y)_m$ одержували на основі вимірювань магнітної сприйнятливості $Hg_{1-x}Mn_xS$ і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ [3,4,6].

Таблиця 2
Коефіцієнт термоелектричної добротності кристалів $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$

$(x+y)_m$	$n \cdot 10^{-18}, \text{ см}^{-3}$	$\sigma, \text{ Ом}^{-1} \text{ см}^{-1}$	$\alpha, \text{ мкВ}/\text{град}$	$Z \cdot 10^3, \text{ град}^{-1}$	Відпал
0,037	14	464	50	0,06	до відпалу
	1,6	360	120	0,26	до відпалу
	2,1	320	160	0,41	відпал в парах сірки
	42	120	450	1,22	до відпалу
0,06	0,1	72	170	0,1	відпал в парах ртуті

На завершення ще раз відзначимо, що отримані великі значення коефіцієнта термоелектричної добротності (Z) кристалів $Hg_{1-x}Mn_xS$ і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$ (некарактерні для інших твердих розчинів на основі халькогенідів ртуті) носять оціночний характер, дійсні значення Z можна було б отримати при наявності експериментальних результатів по дослідженню теплопровідності (λ) кристалів $Hg_{1-x}Mn_xS$ і $Hg_{1-x-y}Mn_xFe_yS$.

Список літератури

1. Э. В. Осипов Твердотельная криогеника. К.: Наукова думка 1977 — 236 с.
2. Томашик В. Н., Грыцив В. И. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений $A^{II}B^{VI}$. — Киев: Наукова думка, 1982. 168с.
3. Мар'янчук П. Д., Андрушак Г. О., Майструк Е. В. // Фізика і хімія твердого тіла. 2008. Т.9 №4. С. 706-710.
4. Мар'янчук П. Д., Андрушак Г. О. // Нові технології. 2008. Т.20 № 2. С. 129–134.
5. Могилевский Б. М., Чудновский А. Ф. Теплопроводность полупроводников. — М.: Наука, 1972. — 536с.
6. Мар'янчук П. Д., Андрушак Г. О. // Изв. вузов. Физика. 2008 Т.51. №3. — С. 59-63.